

## 从整体到细节、从三维到四维

材料结构和性能表征一直是科研和产业发展的基础，以往对样品简单的局部取样分析已经远远不能满足当前的需求，从整体到细节、从三维到四维（原位动态）的微观综合分析已经成为现在科研工作的关键技术。

TESCAN 专注于扫描电子显微镜和 X 射线 CT 领域，为各行业客户提供成熟的二维、三维、四维的微分析综合解决方案。



## TESCAN UniTOM

### 模块化、配置灵活，亚微米级三维 X 射线成像

TESCAN UniTOM 是一款灵活的高分辨率 X 射线 CT 系统，可针对特定应用量身定制，以最大限度地提高图像质量和分辨率。可提供不同配置，从单一来源检测器配置到具有多个 X 射线源和检测器的更灵活的系统。

## 主要优势

### ※ 根据用户需求定制

UniTOM 是一款配置灵活的高分辨 X 射线 CT 显微镜，可根据用户的需求组合功能模块，最大限度的提高图像质量、分辨率和分析速度。

### ※ 感兴趣区域的直观观测

可在概览图上选择感兴趣区域进行实时缩放，获得孔隙结构和矿物的细节信息。

### ※ 亚微米级分辨率

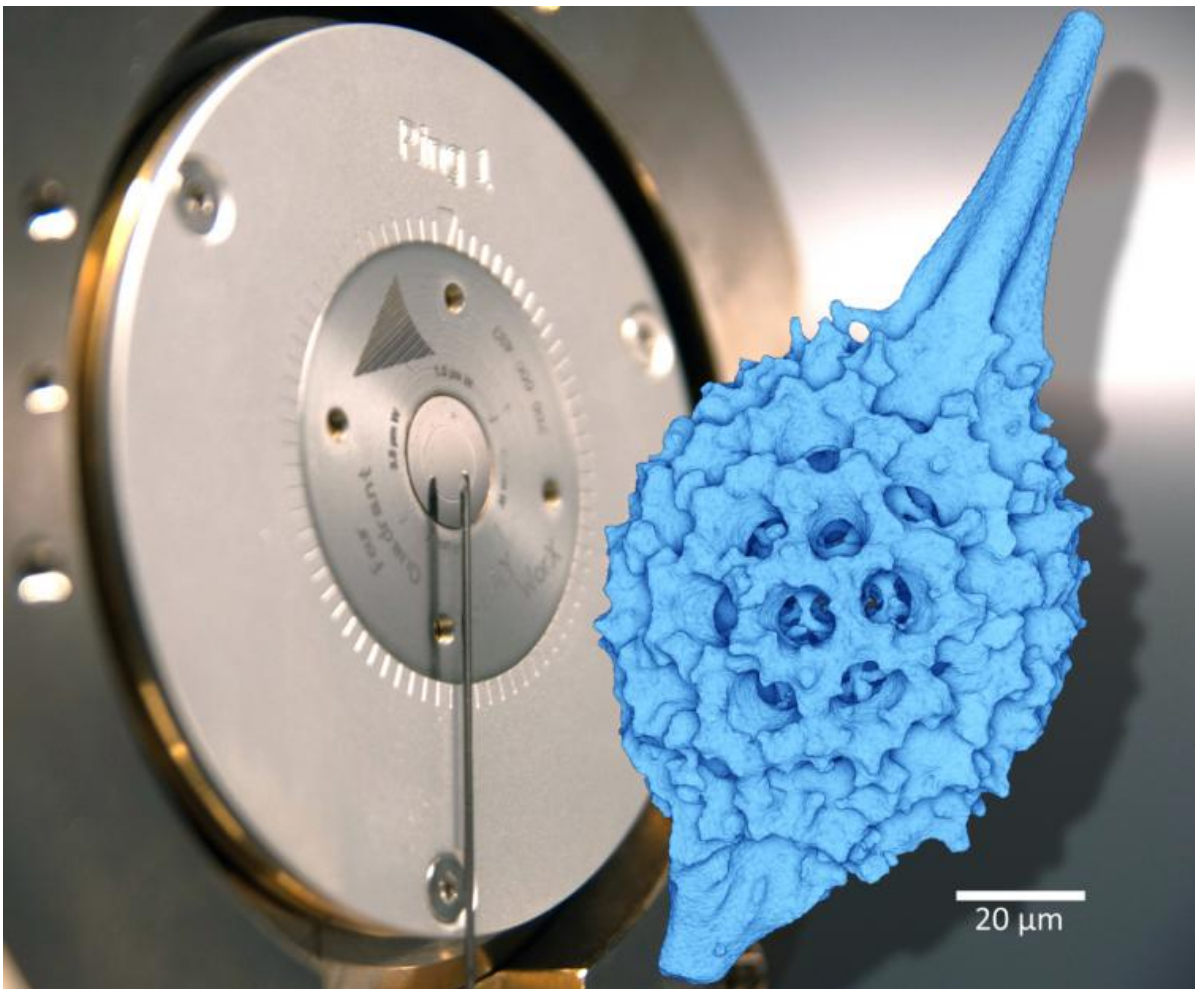
UniTOM 可以获得 500 nm 的真实空间分辨率，并且适用于多种类型和尺寸的样品，可分析的样品最大直径为 40 cm，最大高度 50 cm。

### ※ 模块化设置

模块化设计，硬件模块（如可附加的 X 射线源或探测器）可以轻松集成到系统中，方便用户进行硬件升级或更换单个硬件，进而延长系统的使用寿命。

## 模块化灵活配置，分辨率最小可达 500 nm

UniTOM 是一款多功能的亚微米 X 射线显微 CT 系统，可以达到最小 500 nm 的真实空间分辨率。该系统非常灵活，可处理多种样品类型和尺寸，样品最大直径可达 30 cm，高度可达 50 cm。UniTOM 具有模块化设置，其中每个新组件硬件（例如附加的 X 射线源或检测器）可以轻松集成到系统中，从而允许将来硬件升级或单个组件的简单替换，延长 X 射线系统的使用寿命。



放射虫高分辨 3D 成像—UniTOM

## 选配 & 定制

### ※ 集成的原位套件

系统附加的输入/输出组件、高级电缆管理组件、系统内部 IO 接口，集成采集软件。

### ※ Multi-detector

系统中可以集成多个检测器，最大限度地提高灵活性和性能。